

Institut luxembourgeois de la normalisation de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

**ILNAS-EN IEC 62228-3:2019** 

Circuits intégrés - Évaluation de la CEM des émetteurs-récepteurs - Partie 3: Émetteurs-récepteurs CAN

Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers

Integrierte Schaltungen - Bewertung der elektromagnetischen Verträglichkeit von Sende-Empfangsgeräten - Teil 3: CAN-Sende-Empfangsgeräte

01011010010 0011010010110100101010101111

#### **Avant-propos national**

Cette Norme Européenne EN IEC 62228-3:2019 a été adoptée comme Norme Luxembourgeoise ILNAS-EN IEC 62228-3:2019.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) :

- Influencer et participer à la conception de normes
- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

#### CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres moyens sans autorisation préalable!

### NORME EUROPÉENNE IL NAS-EN IEC 62228-3:2 EN IEC 62228-3

### **EUROPÄISCHE NORM**

**EUROPEAN STANDARD** 

Mai 2019

ICS 31.200

#### Version française

Circuits intégrés - Évaluation de la CEM des émetteursrécepteurs - Partie 3: Émetteurs-récepteurs CAN (IEC 62228-3:2019)

Integrierte Schaltungen - Bewertung der elektromagnetischen Verträglichkeit von Sende-Empfangsgeräten - Teil 3: CAN-Sende-Empfangsgeräte (IEC 62228-3:2019) Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers (IEC 62228-3:2019)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2019-04-15. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à cette Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du CEN-CENELEC Management Centre ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au CEN-CENELEC Management Centre, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung European Committee for Electrotechnical Standardization

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

#### Avant-propos européen

Le texte du document 47A/1050/CDV, future édition 1 de IEC 62228-3, préparé par le SC 47A "Circuits intégrés" de CE 47 de l'IEC "Dispositifs à semiconducteurs", a été soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN IEC 62228-3:2019.

Les dates suivantes sont fixées:

- date limite à laquelle ce document doit être mis en application au (dop) 2020-01-15 niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement
- date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être (dow) 2022-04-15 annulées

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

#### Notice d'entérinement

Le texte de la Norme internationale IEC 62228-3:2019 a été approuvé par le CENELEC comme Norme Européenne sans aucune modification.

Dans la version officielle, ajouter dans la Bibliographie les notes suivantes pour les normes indiquées:

IEC 61000-4-4 NOTE Harmonisée comme EN 61000-4-4
CISPR 16-1-1 NOTE Harmonisée comme EN 55016-1-1

#### **Annexe ZA**

(normative)

## Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique.

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes listées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: <a href="www.cenelec.eu">www.cenelec.eu</a>.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	EN/HD	<u>Année</u>
IEC 61967-1	-	Circuits intégrés - Mesure des émissions électromagnétiques - Partie 1: Conditions générales et définitions	EN IEC 61967-1	-
IEC 61967-4	-	Circuits intégrés - Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz - Partie 4 : Mesure des émissions conduites - Méthode par couplage direct 1 ohm/150 ohm	EN 61967-4	-
IEC 62132-1	-	Circuits intégrés - Mesure de l'immunité électromagnétique - Partie 1: Conditions générales et définitions	EN 62132-1	-
IEC 62132-4	-	Circuits intégrés - Mesure de l'immunité électromagnétique 150 kHz à 1 GHz - Partie 4: Méthode d'injection directe de puissance RF	EN 62132-4	-
IEC 62215-3	-	Circuits intégrés - Mesure de l'immunité aux impulsions - Partie 3: Méthode d'injection de transitoires non synchrones	EN 62215-3	-
IEC 62228-1	-	Circuits intégrés - Évaluation CEM des émetteurs-récepteurs - Partie 1: Conditions générales et définitions	EN IEC 62228-1	-
ISO 7637-2	-	Véhicules routiers - Perturbations électriques par conduction et par couplage - Partie 2: Perturbations électriques transitoires par conduction uniquement le long des lignes d'alimentation	-	-
ISO 10605	-	Véhicules routiers - Méthodes d'essai des perturbations électriques provenant de décharges électrostatiques	-	-
ISO 11898-1	-	Road vehicles - Controller area network (CAN) - Part 1: Data link layer and physical signalling	-	-
ISO 11898-2	-	Road vehicles - Controller area network (CAN) - Part 2: High-speed medium access unit	-	-



IEC 62228-3

Edition 1.0 2019-03

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE



Integrated circuits – EMC evaluation of transceivers – Part 3: CAN transceivers

Circuits intégrés – Évaluation de la CEM des émetteurs-récepteurs – Partie 3: Émetteurs-récepteurs CAN



#### SOMMAIRE

А١	/ANT-P	ROPOS	81
1	Dom	aine d'application	83
2	Réfé	rences normatives	83
3	Term	nes, définitions et termes abrégés	84
	3.1	Termes et définitions	
	3.2	Termes abrégés	85
4	Géne	éralités	
5	Cond	ditions d'essai et conditions de fonctionnement	87
	5.1	Conditions d'alimentation et conditions ambiantes	
	5.2	Modes de fonctionnement pour l'essai	
	5.3	Configuration d'essai	
	5.3.1	· ·	
	5.3.2		
	5.3.3		
	5.3.4		
	5.4	Signaux d'essai	91
	5.4.1	Généralités	91
	5.4.2	Signaux d'essai pour le mode fonctionnel normal	92
	5.4.3	Signal d'essai pour la phase de réveil du mode basse puissance	93
	5.5	Critères d'évaluation	
	5.5.1		
	5.5.2	- <b>'</b>	98
	5.5.3	Critères d'évaluation en mode passif, après exposition aux perturbations	105
	5.5.4	Classes d'état	106
6	Essa	ii et mesure	106
	6.1	Emission de perturbations radioélectriques	106
	6.1.1	Méthode d'essai	106
	6.1.2	Disposition d'essai	106
	6.1.3	,	
	6.2	Immunité aux perturbations radioélectriques	
	6.2.1		
	6.2.2		
	6.2.3	•	
	6.3	Immunité aux impulsions	
	6.3.1		
	6.3.2	•	
	6.3.3	•	
	6.4	Décharge électrostatique (DES)	
	6.4.1		
	6.4.2	'	
7	6.4.3	Mode opératoire d'essai et paramètresoort d'essai	
Αľ	mexe A	، (normative) Circuits d'essai CAN	1∠4

A.1	Généralités	124
A.2	Circuit d'essai pour les émetteurs-récepteurs CAN dans les modes fonctionnels	124
A.3	Circuit d'essai pour les émetteurs-récepteurs CAN dans l'essai des décharges électrostatiques	129
Annexe B	(normative) Cartes d'essai	
B.1	Carte d'essai pour les essais dans les modes fonctionnels	131
B.2	Essai des décharges électrostatiques	131
Annexe C CAN dans	(informative) Exemples de limites d'essai pour les émetteurs-récepteurs les applications automobiles	133
C.1	Généralités	133
C.2	Emission de perturbations radioélectriques	133
C.3	Immunité aux perturbations radioélectriques	134
C.4	Immunité aux impulsions	137
C.5	Décharge électrostatique (DES)	138
	(informative) Caractérisation de la réjection du mode commun pour les du bus CAN	139
D.1	Généralités	139
D.2	Abréviations	139
D.3	Essai CMC	139
D.3.1	Généralités	139
D.3.2	Mesure de la non-adaptation de l'inductance de fuite	140
D.3.3	Mesure du paramètre "S" du mode mixte	145
D.3.4	9	
D.3.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Bibliograp	hie	156
•	Configuration générale pour les essais sur un réseau d'émetteur-récepteur	88
	Configuration générale pour l'essai des décharges électrostatiques en mode	88
•	Essais de réseau d'émetteur-récepteur – ports de couplage et réseaux de	89
	Ports de couplage et réseaux de couplage pour les essais des décharges	91
	Définition des points de déclenchement et des masques de violation pour eurs-récepteurs CAN avec une capacité de taux de transfert flexible	103
Figure 6 -	Ecart maximal sur la caractéristique IV	105
_	Disposition d'essai pour la mesure des perturbations radioélectriques	
•	Disposition d'essai pour les essais DPI	
	Disposition d'essai pour les essais d'immunité aux impulsions	
Figure 10	Disposition d'essai pour les essais de décharge électrostatique directe –  principale	
Figure 11	Disposition d'essai pour les essais des décharges électrostatiques directes	
Figure A.1	on et contrôle	
	dard, dans les modes fonctionnels L – Schéma général du circuit du réseau d'essai des émetteurs-récepteurs	127
	s les modes fonctionnels	129

Figure A.3 – Schéma général du circuit pour les essais des décharges électrostatiques directes des émetteurs-récepteurs CAN, en mode passif	130
Figure B.1 – Exemple d'interconnexions de CI pour transfert de signal CAN	131
Figure B.2 – Exemple de carte d'essai de DES pour les émetteurs-récepteurs CAN	132
Figure C.1 – Exemple de limites pour les émissions radioélectriques – CAN avec filtre de bus	133
Figure C.2 – Exemple de limites pour les émissions radioélectriques – autres broches externes	134
Figure C.3 – Exemple de limites pour les émissions radioélectriques – alimentations locales	134
Figure C.4 – Exemple de limites pour l'immunité aux perturbations radioélectriques pour la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> – CAN avec filtre de bus	135
Figure C.5 – Exemple de limites pour l'immunité aux perturbations radioélectriques, pour la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> – CAN	135
Figure C.6 – Exemple de limites pour l'immunité aux perturbations radioélectriques pour la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> – autres broches externes	136
Figure C.7 – Exemple de limites pour l'immunité aux perturbations radioélectriques pour la classe d'état fonctionnel C <sub>IC</sub> ou D <sub>IC</sub> – CAN avec filtre de bus	137
Figure C.8 – Exemple de limites pour l'immunité aux perturbations radioélectriques pour la classe d'état fonctionnel C <sub>IC</sub> ou D <sub>IC</sub> – autres broches externes	137
Figure D.1 – Schéma électrique général d'une CMC	140
Figure D.2 – Montage d'essai pour des mesures de paramètre "S" à 2 ports pour l'évaluation de l'inductance de fuite	141
Figure D.3 – Exemple d'une carte d'essai à deux ports pour la caractérisation de l'inductance de fuite de la CMC	141
Figure D.4 – Exemple de résultats des mesures de la caractérisation de la CMC	145
Figure D.5 – Montage d'essai pour les mesures du paramètre "S"	146
Figure D.6 – Exemple de carte d'essai de mesure du paramètre "S" – mode mixte, couche supérieure	147
Figure D.7 – Exemple de carte d'essai de mesure du paramètre "S" – extrémité unique, couche supérieure	148
Figure D.8 – Caractéristiques recommandées pour S <sub>dd21</sub> (IL)	150
Figure D.9 – Caractéristiques recommandées pour S <sub>cc21</sub> (CMR)	150
Figure D.10 – Caractéristique recommandée pour $S_{ m sd21}$ et $S_{ m sd12}$ (DCMR)	
Figure D.11 – Montage d'essai pour les essais de dommages de DES	151
Figure D.12 – Exemple de carte d'essai de DES, couche supérieure	152
Figure D.13 – Montage d'essai pour les mesures de la saturation RF	154
Figure D.14 – Exemple de carte d'essai de saturation RF / paramètre "S", couche supérieure	154
Tableau 1 – Vue d'ensemble des mesures et essais	86
Tableau 2 – Conditions d'alimentation et conditions ambiantes pour le fonctionnement	
Tableau 3 – Essais de réseau d'émetteur-récepteur – Définitions des valeurs des composantes des ports de couplage et des réseaux de couplage	90
Tableau 4 – Définitions des ports de couplage pour les essais des décharges électrostatiques	91
Tableau 5 – Signal d'essai de communication TX1	
Tableau 6 – Signal d'essai de communication TX2a	
<del>-</del>	

Tableau 7 – Signal d'essai de communication TX2b	93
Tableau 8 – Signal d'essai de réveil TX3	94
Tableau 9 – Signal d'essai de communication TX4a	94
Tableau 10 – Signal d'essai de communication TX4b	95
Tableau 11 – Signal d'essai de communication TX4c	95
Tableau 12 – Signal d'essai de communication TX4d	95
Tableau 13 – Signal d'essai de communication TX4e	96
Tableau 14 – Signal d'essai de communication TX4f1	96
Tableau 15 – Signal d'essai de communication TX4f2	96
Tableau 16 – Signal d'essai de communication TX4g	97
Tableau 17 – Signal d'essai de communication TX4h	97
Tableau 18 – Signal d'essai de communication TX4i	97
Tableau 19 – Critères d'évaluation pour les fonctions standard de l'émetteur-récepteur CAN	99
Tableau 20 – Critères d'évaluation pour les émetteurs-récepteurs CAN avec une fonctionnalité de mise en réseau partielle	. 100
Tableau 21 – Définition spécifique pour le mode opératoire d'essai prévu pour l'évaluation de la fonction de mise en réseau partielle de l'émetteur-récepteur CAN	101
Tableau 22 – Critères d'évaluation pour les émetteurs-récepteurs CAN avec une capacité de taux de transfert flexible	. 102
Tableau 23 – Définition des masques de violation pour les émetteurs-récepteurs CAN avec une capacité de taux de transfert flexible	. 104
Tableau 24 – Définition des classes d'état fonctionnel	.106
Tableau 25 – Paramètres des équipements de mesure des émissions radioélectriques	.108
Tableau 26 – Mesures des émissions radioélectriques	.108
Tableau 27 – Spécifications pour les essais DPI	.110
Tableau 28 – Essais DPI pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> de la fonction standard de l'émetteur-récepteur CAN	111
Tableau 29 – Essais DPI pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> de la fonction de mise en réseau partielle de l'émetteur-récepteur CAN	112
Tableau 30 – Essais DPI pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> de la fonction CAN FD de l'émetteur-récepteur CAN	. 113
Tableau 31 – Essais DPI pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel C <sub>IC</sub> ou D <sub>IC</sub> des émetteurs-récepteurs CAN	. 113
Tableau 32 – Spécifications pour les essais d'immunité aux impulsions	.116
Tableau 33 – Paramètres de l'essai d'immunité aux impulsions	.116
Tableau 34 – Essais d'immunité aux impulsions pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> de la fonction standard de l'émetteur-récepteur CAN	117
Tableau 35 – Essais d'immunité aux impulsions pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> de la fonction de mise en réseau partielle de l'émetteur-récepteur CAN	118
Tableau 36 – Essais d'immunité aux impulsions pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel A <sub>IC</sub> de la fonction CAN FD de l'émetteur-récepteur CAN	118
Tableau 37 – Essais d'immunité aux impulsions pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel C <sub>IC</sub> ou D <sub>IC</sub> des émetteurs-récepteurs CAN	. 119
Tableau 38 – Spécifications pour les essais des décharges électrostatiques directes	.122
Tableau 39 – Essais de décharge électrostatique en mode passif pour l'évaluation de la classe d'état fonctionnel D <sub>IC</sub> des émetteurs-récepteurs CAN	. 122

ableau B.1 – Paramètres de la carte d'essai de DES	132
ableau C.1 – Exemple de limites pour l'immunité aux perturbations radioélectriques, pour les classes d'état fonctionnel C <sub>IC</sub> ou D <sub>IC</sub>	138
ableau D.1 – Mode opératoire d'essai et paramètres pour l'évaluation de l'inductance le fuite	143
ableau D.2 – Mesures de l'inductance de fuite	144
ableau D.3 – Classes de non-adaptation de l'inductance de fuite	145
ableau D.4 – Mode opératoire d'essai et paramètres pour la caractérisation de la arte d'essai à 3 ports	147
ableau D.5 – Mode opératoire d'essai et paramètres pour les mesures du paramètre "S'	' .148
ableau D.6 – Mesures exigées du paramètre "S"	149
ableau D.7 – Paramètres d'essai pour les essais de dommages de DES	153
ableau D.8 – Essais de DES exigés pour les dommages	153
ableau D.9 – Mode opératoire d'essai et paramètres pour les essais de saturation RF	155
ableau D.10 – Essais de saturation RF exigés	155